

News & Analysis

EU fördert Projekt zur Verringerung der Leckströme

EE Times

1/10/2006 05:00 PM EST

[Post a comment](#)

Tweet

Share

G+1

0

LONDON — Die EU-Kommission unterstützt ein dreijähriges Projekt zur Entwicklung von Designmethoden, mit welchen die Leckströme in NanoCMOS-SoCs reduziert werden sollen. Damit sollen die Batterielaufzeiten beim Einsatz von Chips jenseits des 65-nm-Node reduziert werden.

Das Projekt mit Namen CLEAN wird von STMicroelectroncis koordiniert. Partner sind Infineon, ChipVision Design Systems, das Edacentrum in Hannover, CEA-LETI sowie diverse Universäten in Italien, Spanien, Polen und Dänemark. Die EU fördert das Projekt mit 4,5 Millionen Euro aus dem 6. IST Framework-Programm.

Ein brennendes Problem beim Design von Schaltkreisen mit Strukturen kleiner als 65 Nanometer sind die überproportional ansteigenden Leckströme. Diese Leckströme könnten nach Auffassung von Beobachtern der weiteren Verkleinerung der Chipstrukturen massive Hindernisse in den Weg legen. Das Forschungsprojekt soll nun von der Modellierung bis zur Optimierung und von Designlösungen bis zur Methodik unterschiedliche Bereiche des Low-Leakage-Designs ergründen. Die Ergebnisse werden nach Auffassung von Beteiligten der europäischen Nanoelektronik Impulse vermitteln; vor allem gilt das für die Bereiche Consumerelektronik und EDA-Tools.

[EMAIL THIS](#) [PRINT](#) [COMMENT](#)

Copyright © 2016 UBM Electronics, A UBM company, All rights reserved. [Privacy Policy](#) | [Terms of Service](#)